
**Surface chemical analysis — Depth
profiling — Methods for ion beam
alignment and the associated
measurement of current or current
density for depth profiling in AES and
XPS**

*Analyse chimique des surfaces — Profilage d'épaisseur — Méthodes
d'alignement du faisceau d'ions et la mesure associée de densité de
courant ou de courant pour le profilage d'épaisseur en AES et XPS*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn